

京都産業大学

コンピュータ理工学部

コロキウム(談話会)

※事前申込不要・入場無料



日時 2014年 10月 1日(水) 13:15~14:40

場所 京都産業大学 14号館 1階 14102教室

講師 吉村 正義 准教授 (京都産業大学 コンピュータ理工学部)

演題 LSIにおけるソフトエラーの耐性評価手法について

要旨 LSIの大規模化、微細化に伴い、ソフトエラーは記憶素子だけでなく論理ゲートにおいても発生し、チップ当たりのソフトエラーの発生確率は増加する傾向にある。ここでソフトエラーの発生はLSIの誤動作となるとは限らず、セルの構造、発生した箇所、論理構造、発生時の状態、発生後の入力などによって決まる。ソフトエラー耐性の評価手法にはLSIを用いた実測による測定もしくはシミュレーションを用いた方法がある。

今回はこれら二つの耐性評価手法について紹介する。実機による測定は、ソフトエラーの発生確率はさほど高くないため、効率よく実測を行うことが求められる。シミュレーションによる評価手法は精度と処理時間が課題となっている。現状の耐性評価手法がこれらについてどのように取り組んでいるか紹介する。

交通 地下鉄「国際会館」下車、京都バス(40系統)で京都産業大学前下車
地下鉄「北大路」下車、市バス(北3号系統)で京都産大前下車
※キャンパス内には、駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。

お問合せ 京都産業大学 コンピュータ理工学部事務室
〒603-8555 京都市北区上賀茂本山 Tel. 075-705-1989

キャンパス内
アクセスマップ

